



IEC 62586-2

Edition 2.1 2021-09
CONSOLIDATED VERSION

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Power quality measurement in power supply systems –
Part 2: Functional tests and uncertainty requirements**

**Mesure de la qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation –
Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 17.220.20

ISBN 978-2-8322-5343-4

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



**Power quality measurement in power supply systems –
Part 2: Functional tests and uncertainty requirements**

**Mesure de la qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation –
Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude**



CONTENTS

FOREWORD.....	9
INTRODUCTION.....	11
1 Scope.....	12
2 Normative references.....	12
3 Terms, definitions, abbreviated terms, notations and symbols.....	13
3.1 General terms and definitions	13
3.2 Terms and definitions related to uncertainty.....	13
3.3 Notations	14
3.3.1 Functions.....	14
3.3.2 Symbols and abbreviated terms.....	14
3.3.3 Indices.....	14
4 Requirements	14
4.1 Requirements for products complying with class A	14
4.2 Requirements for products complying with class S	15
5 Functional type tests common requirements	17
5.1 General philosophy for testing	17
5.1.1 System topology	17
5.1.2 Stabilization time	17
5.1.3 Measuring ranges	17
5.1.4 Single "power-system influence quantities"	19
5.1.5 "External influence quantities"	21
5.1.6 Test criteria	21
5.2 Testing procedure	22
5.2.1 Device under test.....	22
5.2.2 Testing conditions	22
5.2.3 Testing equipment	22
6 Functional testing procedure for instruments complying with class A according to IEC 61000-4-30	22
6.1 Power frequency	22
6.1.1 General	22
6.1.2 Measurement method.....	23
6.1.3 Measurement uncertainty and measuring range	23
6.1.4 Measurement evaluation	24
6.1.5 Measurement aggregation	24
6.2 Magnitude of supply voltage	24
6.2.1 Measurement method.....	24
6.2.2 Measurement uncertainty and measuring range	24
6.2.3 Measurement evaluation	25
6.2.4 Measurement aggregation	25
6.3 Flicker	27
6.4 Supply voltage interruptions, dips and swells	27
6.4.1 General	27
6.4.2 Check dips / interruptions in polyphase system.....	39
6.4.3 Check swells in polyphase system.....	41
6.5 Supply voltage unbalance.....	42
6.5.1 General	42

6.5.2	Measurement method, measurement uncertainty and measuring range	43
6.5.3	Aggregation	43
6.6	Voltage harmonics	43
6.6.1	Measurement method.....	43
6.6.2	Measurement uncertainty and measuring range.....	44
6.6.3	Measurement evaluation	45
6.6.4	Measurement aggregation	45
6.7	Voltage interharmonics.....	47
6.7.1	Measurement method.....	47
6.7.2	Measurement uncertainty and measuring range.....	48
6.7.3	Measurement evaluation	49
6.7.4	Measurement aggregation	49
6.8	Mains signalling voltages on the supply voltage	51
6.8.1	Measurement method.....	51
6.8.2	Measurement uncertainty and measuring range	53
6.8.3	Aggregation	54
6.9	Measurement of underdeviation and overdeviation parameters.....	54
6.9.1	Measurement method.....	54
6.9.2	Measurement uncertainty and measuring range	56
6.9.3	Measurement evaluation	57
6.9.4	Measurement aggregation	57
6.10	Flagging.....	60
6.11	Clock uncertainty testing	62
6.12	Variations due to external influence quantities	62
6.12.1	General	62
6.12.2	Influence of temperature	63
6.12.3	Influence of power supply voltage.....	65
6.13	Rapid voltage changes (RVC).....	66
6.13.1	RVC parameters and evaluation	66
6.13.2	General	67
6.13.3	"No RVC" tests	69
6.13.4	"RVC threshold and setup" test	78
6.13.5	"RVC parameters" test	81
6.13.6	"RVC polyphase" tests	84
6.13.7	"Voltage is in steady-state condition" tests.....	87
6.14	Magnitude of current	92
6.15	Harmonic current	93
6.16	Interharmonic currents	93
6.17	Current unbalance.....	93
6.17.1	General	93
6.17.2	Measurement method, measurement uncertainty and measuring range	94
7	Functional testing procedure for instruments complying with class S according to IEC 61000-4-30	94
7.1	Power frequency	94
7.1.1	General	94
7.1.2	Measurement method.....	95
7.1.3	Measurement uncertainty and measuring range	95
7.1.4	Measurement evaluation	96
7.1.5	Measurement aggregation	96

7.2	Magnitude of the supply voltage	96
7.2.1	Measurement method.....	96
7.2.2	Measurement uncertainty and measuring range	96
7.2.3	Measurement evaluation	97
7.2.4	Measurement aggregation	97
7.3	Flicker	99
7.4	Supply voltage interruptions, dips and swells	99
7.4.1	General requirements.....	99
7.4.2	Check dips / interruptions in polyphase system.....	105
7.4.3	Check swells in polyphase system.....	107
7.5	Supply voltage unbalance.....	108
7.5.1	General	108
7.5.2	Measurement method, measurement uncertainty and measuring range	109
7.5.3	Aggregation	109
7.6	Voltage harmonics	109
7.6.1	General	109
7.6.2	Measurement method.....	110
7.6.3	Measurement method, measurement uncertainty and measuring range	111
7.6.4	Measurement evaluation	112
7.6.5	Measurement aggregation	112
7.7	Voltage interharmonics.....	114
7.8	Mains signalling voltages on the supply voltage	114
7.8.1	General	114
7.8.2	Measurement method.....	115
7.8.3	Measurement uncertainty and measuring range	115
7.8.4	Aggregation	115
7.9	Measurement of underdeviation and overdeviation parameters.....	115
7.10	Flagging.....	115
7.11	Clock uncertainty testing	117
7.12	Variations due to external influence quantities	118
7.12.1	General	118
7.12.2	Influence of temperature	119
7.12.3	Influence of power supply voltage.....	121
7.13	Rapid voltage changes	122
7.14	Magnitude of current	122
7.15	Harmonic current	122
7.16	Interharmonic currents	122
7.17	Current unbalance.....	122
7.17.1	General	122
7.17.2	Measurement method, measurement uncertainty and measuring range	123
8	Calculation of measurement uncertainty and operating uncertainty	124
Annex A (normative)	Intrinsic uncertainty and operating uncertainty,.....	126
A.1	General.....	126
A.2	Measurement uncertainty	126
A.3	Operating uncertainty	127
Annex B (informative)	Overall system uncertainty	128
Annex C (normative)	Calculation of measurement and operating uncertainty for voltage magnitude and power frequency.....	129

C.1	Selection of test points to verify operating uncertainty and uncertainty under reference conditions.....	129
C.2	Class A calculation examples	129
C.2.1	General	129
C.2.2	Parameter: magnitude of supply voltage, $U_{\text{din}} = 230 \text{ V}$, 50/60Hz, rated range of temperature -25°C to $+55^{\circ}\text{C}$	129
C.2.3	Parameter: power frequency 50/60 Hz, rated range of temperature -25°C to $+55^{\circ}\text{C}$	130
Annex D (informative)	Further test on dips (amplitude and phase angles changes).....	132
D.1	Phase-to-phase or phase-to-neutral testing.....	132
D.2	Test method.....	132
Annex E (informative)	Further tests on dips (polyphase): test procedure	134
E.1	General.....	134
E.2	Phase voltage dips and interruptions	135
E.3	Phase swells.....	135
Annex F (normative)	Gapless measurements of voltage amplitude and harmonics test	137
F.1	Purpose of the test.....	137
F.2	Test set up.....	137
F.3	Voltage amplitude	137
F.3.1	Test signal	137
F.3.2	Result evaluation	137
F.4	Harmonics	138
F.4.1	Test signal	138
F.4.2	Result evaluation	138
F.5	Inter-harmonics	139
F.5.1	Test signal	139
F.5.2	Result evaluation	139
Annex G (informative)	Gapless measurements of voltage amplitude and harmonics	140
Annex H (informative)	Testing equipment recommendations	149
H.1	Testing range	149
H.2	Uncertainty and stability of source and reference meter	149
H.2.1	Uncertainty of source and reference meter	149
H.2.2	Stability of the source.....	150
H.3	Time synchronisation	150
H.4	Power quality functions of source and reference meter.....	150
H.5	Traceability	151
Annex I (informative)	Recommendations related to a declaration of conformity (DoC) and a test report	152
I.1	Definitions.....	152
I.2	Recommendations.....	152
I.3	Example of IEC 62586-1 declaration of conformity	152
I.4	Example of IEC 62586-2 declaration	154
I.4.1	General	154
I.4.2	Recommendation for IEC 62586-2 test report	155
I.4.3	Recommendation for IEC 62586-2 test summary.....	156
I.4.4	Recommendation for IEC 62586-2 test equipment information.....	156
I.4.5	Recommendation for IEC 62586-2 tested functions	156
Bibliography	157

Figure 1 – Overview of test for dips according to test A4.1.1	31
Figure 2 – Detail 1 of waveform for test of dips according to test A4.1.1	32
Figure 3 – Detail 2 of waveform for tests of dips according to A4.1.1	33
Figure 4 – Detail 3 of waveform for tests of dips according to test A4.1.1	33
Figure 5 – Detail 1 of waveform for test of dips according to test A4.1.2	34
Figure 6 – Detail 2 of waveform for tests of dips according to test A4.1.2	35
Figure 7 – Detail 1 of waveform for test of swells according to test A4.1.2	36
Figure 8 – Detail 2 of waveform for tests of swells according to test A4.1.2	37
Figure 9 – Sliding reference voltage test	38
Figure 10 – Sliding reference start up condition	38
Figure 11 – Detail 1 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	40
Figure 12 – Detail 2 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	40
Figure 13 – Detail 3 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	41
Figure 14 – Detail 1 of waveform for test of polyphase swells	42
Figure 15 – Detail 2 of waveform for test of polyphase swells	42
Figure 16 – Flagging test for class A	61
Figure 17 – Clock uncertainty testing	62
Figure 18 – Example of RVC event	67
Figure 19 – Test A13.1.1 waveform	70
Figure 20 – Test A13.1.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	71
Figure 21 – Test A13.1.2 waveform	73
Figure 22 – Test A13.1.2 waveform with RVC limits and arithmetic means at 50 Hz	74
Figure 23 – Test A13.1.3 waveform	76
Figure 24 – Test A13.1.3 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	77
Figure 25 – Test A13.2.1 waveform	79
Figure 26 – Test A13.2.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	80
Figure 27 – Test A13.3.1 waveform	82
Figure 28 – Test A13.3.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	83
Figure 29 – Test A13.4.1 waveform at 50 Hz	85
Figure 47 – Test A13.4.1 waveform with RVC limits and VSS at 50 Hz	86
Figure 30 – Test A13.5.1 waveform	88
Figure 31 – Test A13.5.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	89
Figure 32 – Test A13.5.2 waveform	91
Figure 33 – Test A13.5.2 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	92
Figure 34 – Detail 1 of waveform for test of dips according to test S4.1.2	102
Figure 35 – Detail 2 of waveform for tests of dips according to test S4.1.2	102
Figure 36 – Detail 1 of waveform for test of swells according to test S4.1.2	103
Figure 37 – Detail 2 of waveform for tests of swells according to test S4.1.2	103
Figure 38 – Sliding reference voltage test	104
Figure 39 – Sliding reference start-up condition	104
Figure 40 – Detail 1 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	106
Figure 41 – Detail 2 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	106
Figure 42 – Detail 3 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	107

Figure 43 – Detail 1 of waveform for test of polyphase swells	108
Figure 44 – Detail 2 of waveform for test of polyphase swells	108
Figure 45 – Flagging test for class S	117
Figure 46 – Clock uncertainty testing.....	118
Figure A.1 – Different kinds of uncertainties	126
Figure D.1 – Phase-to-neutral testing on three-phase systems.....	132
Figure D.2 – Phase-to-phase testing on three-phase systems	132
Figure E.1 – Example for one phase of a typical N cycle injection	134
Figure E.2 – Dip/interruption accuracy (amplitude and timing) test	135
Figure E.3 – Swell accuracy (amplitude and timing) test	136
Figure G.1 – Simulated signal under noisy conditions	140
Figure G.2 – Waveform for checking gapless RMS voltage measurement.....	141
Figure G.3 – 2,3 Hz frequency fluctuation	141
Figure G.4 – Spectral leakage effects for a missing sample	142
Figure G.5 – Illustration of \mathcal{Q}_{RMS} for missing samples.....	143
Figure G.6 – Detection of a single missing sample.....	143
Figure G.7 – \mathcal{Q}_{RMS} for an ideal signal, sampling error = -300×10^{-6}	144
Figure G.8 – \mathcal{Q}_{RMS} for an ideal signal, sampling error = 400×10^{-6}	144
Figure G.9 – \mathcal{Q}_{RMS} for an ideal signal, sampling error = 200×10^{-6}	145
Figure G.10 – $\mathcal{Q}_{\text{H}}(5)$ with ideal test signal and perfect sampling frequency synchronization	146
Figure G.11 – $\mathcal{Q}_{\text{H}}(5)$ with 300×10^{-6} sampling frequency error and 100×10^{-6} modulation frequency error	146
Figure G.12 – \mathcal{Q}_{RMS} with a 20/24-cycle sliding window with an output every 10/12 cycles.....	147
Figure G.13 – Amplitude test for fluctuating component	147
 Table 1 – Summary of type tests for class A	15
Table 2 – Summary of type tests for class S	16
Table 3 – Testing points for each measured parameter	18
Table 4 – List of single "power-system influence quantities".....	20
Table 5 – Influence of temperature	21
Table 6 – Influence of auxiliary power supply voltage	21
Table 7 – List of generic test criteria.....	22
Table 8 – Specification of test A13.1.1	69
Table 9 – Specification of test A13.1.2	72
Table 10 – Specification of test A13.1.3	75
Table 11 – Specification of test A13.2.1	78
Table 12 – Specification of test A13.3.1	81
Table 13 – Specification of test A13.4.1	84
Table 14 – Specification of test A13.5.1	87
Table 15 – Specification of test A13.5.2	90
Table 16 – Uncertainty requirements	125
Table D.1 – Tests pattern.....	133

Table H.1 – Testing range.....	149
Table H.2 – Uncertainty of source and reference meter.....	150
Table H.3 – Stability of source	150
Table I.1 – Example of a DoC related to compliance with IEC 62586-1.....	153
Table I.2 – Example of DoC related to compliance with IEC 62586-2.....	155

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER SUPPLY SYSTEMS –**Part 2: Functional tests and uncertainty requirements****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 62586-2 edition 2.1 contains the second edition (2017-03) [documents 85/525/CDV and 85/571/RVC], its corrigendum 1 (2018-06) and its amendment 1 (2021-09) [documents 85/770/FDIS and 85/795/RVD].

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard IEC 62586-2 has been prepared by IEC technical committee 85: Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities.

This second edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) test procedures for RVC and current have been added;
- b) mistakes have been fixed.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 62586 series, published under the general title *Power quality measurement in power supply systems*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under [webstore.iec.ch](#) in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

Power quality is more and more important worldwide in power supply systems and is generally assessed by power quality instruments.

This part of IEC 62586 specifies functional and uncertainty tests intended to verify the compliance of a product to class A and class S measurement methods defined in IEC 61000-4-30.

This document therefore complements IEC 61000-4-30.

POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER SUPPLY SYSTEMS –**Part 2: Functional tests and uncertainty requirements****1 Scope**

This part of IEC 62586 specifies functional tests and uncertainty requirements for instruments whose functions include measuring, recording, and possibly monitoring power quality parameters in power supply systems, and whose measuring methods (class A or class S) are defined in IEC 61000-4-30.

This document applies to power quality instruments complying with IEC 62586-1.

This document can also be referred to by other product standards (e.g. digital fault recorders, revenue meters, MV or HV protection relays) specifying devices embedding class A or class S power quality functions according to IEC 61000-4-30.

These requirements are applicable in single-, dual- (split phase) and 3-phase AC power supply systems at 50 Hz or 60 Hz.

It is not the intent of this document to address user interface or topics unrelated to device measurement performance.

The document does not cover post-processing and interpretation of the data, for example with dedicated software.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61000-2-4, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-4: Environment – Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances*

IEC 61000-4-7, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7: Testing and measurement techniques – General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto*

IEC 61000-4-15, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-15: Testing and measurement techniques – Flickermeter – Functional and design specifications*

IEC 61000-4-30:2015, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods*

IEC 62586-1:2013, *Power quality measurement in power supply systems – Part 1: Power quality instruments (PQI)*

ISO/IEC Guide 98-3:2008, *Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	165
INTRODUCTION	167
1 Domaine d'application	168
2 Références normatives	168
3 Termes, définitions, termes abrégés, notations et symboles	169
3.1 Termes et définitions généraux	169
3.2 Termes et définitions relatifs à l'incertitude	169
3.3 Notations	170
3.3.1 Fonctions	170
3.3.2 Symboles et abréviations	170
3.3.3 Indices	170
4 Exigences	171
4.1 Exigences concernant les produits conformes à la classe A	171
4.2 Exigences concernant les produits conformes à la classe S	172
5 Exigences communes aux essais de type fonctionnel	174
5.1 Philosophie générale des essais	174
5.1.1 Topologie du système	174
5.1.2 Temps de stabilisation	174
5.1.3 Etendues de mesure	174
5.1.4 "Grandeurs d'influence des réseaux électriques" simples	176
5.1.5 "Grandeurs d'influence externes"	178
5.1.6 Critères d'essai	178
5.2 Procédure d'essai	179
5.2.1 Appareil soumis à l'essai	179
5.2.2 Conditions d'essai	179
5.2.3 Equipement d'essai	179
6 Procédure d'essais fonctionnels pour les instruments conformes à la classe A selon l'IEC 61000-4-30	180
6.1 Fréquence industrielle	180
6.1.1 Généralités	180
6.1.2 Méthode de mesure	180
6.1.3 Incertitude de mesure et étendue de mesure	180
6.1.4 Evaluation de mesure	181
6.1.5 Agrégation de mesure	181
6.2 Amplitude de la tension d'alimentation	181
6.2.1 Méthode de mesure	181
6.2.2 Incertitude de mesure et étendue de mesure	181
6.2.3 Evaluation de mesure	182
6.2.4 Agrégation de mesure	182
6.3 Papillotement	184
6.4 Coupures, creux et surtensions de la tension d'alimentation	184
6.4.1 Généralités	184
6.4.2 Vérification des creux/coupures dans un réseau polyphasé	196
6.4.3 Vérification des surtensions dans un réseau polyphasé	199
6.5 Déséquilibre de tension d'alimentation	200
6.5.1 Généralités	200

6.5.2	Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure	201
6.5.3	Agrégation	201
6.6	Harmoniques de tension	201
6.6.1	Méthode de mesure	201
6.6.2	Incertitude de mesure et étendue de mesure	203
6.6.3	Evaluation de mesure	204
6.6.4	Agrégation de mesure	204
6.7	Interharmoniques de tension	205
6.7.1	Méthode de mesure	205
6.7.2	Incertitude de mesure et étendue de mesure	206
6.7.3	Evaluation de mesure	207
6.7.4	Agrégation de mesure	207
6.8	Tension de transmission de signaux sur la tension d'alimentation	210
6.8.1	Méthode de mesure	210
6.8.2	Incertitude de mesure et étendue de mesure	212
6.8.3	Agrégation	214
6.9	Mesure des paramètres de valeur basse et de valeur haute de la tension	214
6.9.1	Méthode de mesure	214
6.9.2	Incertitude de mesure et étendue de mesure	216
6.9.3	Evaluation de mesure	217
6.9.4	Agrégation de mesure	217
6.10	Marquage	220
6.11	Essai de l'incertitude d'horloge	222
6.12	Variations en fonction des grandeurs d'influence externes	222
6.12.1	Généralités	222
6.12.2	Influence de la température	223
6.12.3	Influence de la tension d'alimentation	225
6.13	Variations rapides de tension (RVC)	226
6.13.1	Paramètres RVC et évaluation	226
6.13.2	Généralités	227
6.13.3	Essais "Pas d'événement RVC"	229
6.13.4	Essai "seuil et configuration RVC"	238
6.13.5	Essai "paramètres RVC"	241
6.13.6	Essais "événement polyphasé RVC"	244
6.13.7	Essais "condition VSS (tension en régime établi)"	247
6.14	Amplitude du courant	253
6.15	Courant harmonique	254
6.16	Courants interharmoniques	254
6.17	Déséquilibre de courant	254
6.17.1	Généralités	254
6.17.2	Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure	254
7	Procédure d'essais fonctionnels pour les instruments conformes à la classe S selon l'IEC 61000-4-30	255
7.1	Fréquence industrielle	255
7.1.1	Généralités	255
7.1.2	Méthode de mesure	255
7.1.3	Incertitude de mesure et étendue de mesure	256
7.1.4	Evaluation de mesure	257
7.1.5	Agrégation de mesure	257

7.2	Amplitude de la tension d'alimentation	257
7.2.1	Méthode de mesure	257
7.2.2	Incertitude de mesure et étendue de mesure	257
7.2.3	Evaluation de mesure.....	258
7.2.4	Agrégation de mesure	258
7.3	Papillotement	260
7.4	Coupures, creux et surtensions de la tension d'alimentation.....	260
7.4.1	Exigences générales	261
7.4.2	Vérification des creux/coupures dans un réseau polyphasé.....	267
7.4.3	Vérification des surtensions dans un réseau polyphasé.....	270
7.5	Déséquilibre de tension d'alimentation	271
7.5.1	Généralités	271
7.5.2	Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure	272
7.5.3	Agrégation	272
7.6	Harmoniques de tension.....	272
7.6.1	Généralités	272
7.6.2	Méthode de mesure	273
7.6.3	Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure	275
7.6.4	Evaluation de mesure.....	276
7.6.5	Agrégation de mesure	276
7.7	Interharmoniques de tension	278
7.8	Tension de transmission de signaux sur la tension d'alimentation.....	278
7.8.1	Généralités	278
7.8.2	Méthode de mesure	279
7.8.3	Incertitude de mesure et étendue de mesure	279
7.8.4	Agrégation	279
7.9	Mesure des paramètres de valeur basse et de valeur haute de la tension.....	279
7.10	Marquage	279
7.11	Essai de l'incertitude d'horloge	281
7.12	Variations en fonction des grandeurs d'influence externes	282
7.12.1	Généralités	282
7.12.2	Influence de la température	283
7.12.3	Influence de la tension d'alimentation	285
7.13	Variations rapides de tension (RVC)	286
7.14	Amplitude du courant	286
7.15	Courant harmonique.....	286
7.16	Courants interharmoniques.....	286
7.17	Déséquilibre de courant.....	286
7.17.1	Généralités	286
7.17.2	Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure	287
8	Calcul de l'incertitude de mesure et de l'incertitude de fonctionnement	288
Annexe A (normative)	Incertitude intrinsèque et incertitude de fonctionnement.....	290
A.1	Généralités	290
A.2	Incertitude de mesure.....	290
A.3	Incertitude de fonctionnement.....	291
Annexe B (informative)	Incertitude système global.....	292
Annexe C (normative)	Calcul des incertitudes de mesure et de fonctionnement pour l'amplitude de tension et la fréquence industrielle	293

C.1	Choix de points d'essai pour vérifier l'incertitude de fonctionnement et l'incertitude dans les conditions de référence	293
C.2	Exemples de calculs pour la classe A	293
C.2.1	Généralités	293
C.2.2	Paramètre: amplitude de la tension d'alimentation, $U_{\text{din}} = 230 \text{ V}$, 50/60 Hz, plage assignée de températures -25°C à $+55^{\circ}\text{C}$	293
C.2.3	Paramètre: fréquence industrielle 50/60 Hz, plage assignée de températures de -25°C à $+55^{\circ}\text{C}$	294
Annexe D (informative)	Essai supplémentaire sur les creux (variations de l'amplitude et des angles de phase)	296
D.1	Essais entre phases ou phase-neutre	296
D.2	Méthode d'essai	296
Annexe E (informative)	Essais supplémentaires sur les creux (polyphasés): procédure d'essai	299
E.1	Généralités	299
E.2	Creux de tension de phase et coupures	300
E.3	Surtensions de phase	301
Annexe F (normative)	Essai des mesures sans intervalles de l'amplitude de tension et des harmoniques	302
F.1	Objectif de l'essai	302
F.2	Configuration de l'essai	302
F.3	Amplitude de tension	302
F.3.1	Signal d'essai	302
F.3.2	Evaluation du résultat	303
F.4	Harmoniques	303
F.4.1	Signal d'essai	303
F.4.2	Evaluation du résultat	303
F.5	Interharmoniques	304
F.5.1	Signal d'essai	304
F.5.2	Evaluation du résultat	304
Annexe G (informative)	Mesures sans intervalles de l'amplitude de tension et des harmoniques	306
Annexe H (informative)	Recommandations relatives à l'équipement d'essai	315
H.1	Plage d'essai	315
H.2	Incertitude et stabilité de la source et du compteur de référence	315
H.2.1	Incertitude de la source et du compteur de référence	315
H.2.2	Stabilité de la source	316
H.3	Synchronisation temporelle	316
H.4	Fonctions de qualité de l'alimentation de la source et du compteur de référence	317
H.5	Traçabilité	317
Annexe I (informative)	Recommandations relatives à la déclaration de conformité et au rapport d'essai	318
I.1	Définitions	318
I.2	Recommandations	318
I.3	Exemple de déclaration de conformité selon l'IEC 62586-1	318
I.4	Exemple de déclaration de conformité selon l'IEC 62586-2	320
I.4.1	Généralités	320
I.4.2	Recommandation pour le rapport d'essai selon l'IEC 62586-2	322
I.4.3	Recommandation pour le résumé de l'essai selon l'IEC 62586-2	322

I.4.4	Recommandation pour les informations sur l'équipement d'essai selon l'IEC 62586-2.....	322
I.4.5	Recommandation pour les fonctions soumises à l'essai selon l'IEC 62586-2.....	322
Bibliographie	323	

Figure 1 – Vue d'ensemble de l'essai pour les creux conformément à l'essai A4.1.1	188
Figure 2 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des creux conformément à l'essai A4.1.1	189
Figure 3 – Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des creux conformément à l'essai A4.1.1	190
Figure 4 – Détail 3 de la forme d'onde pour les essais des creux conformément à l'essai A4.1.1	190
Figure 5 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des creux conformément à l'essai A4.1.2	191
Figure 6 – Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des creux conformément à l'essai A4.1.2	192
Figure 7 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions conformément à l'essai A4.1.2	193
Figure 8 – Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des surtensions conformément à l'essai A4.1.2	194
Figure 9 – Essai de la tension de référence de glissement.....	195
Figure 10 – Condition de démarrage de la référence de glissement.....	195
Figure 11 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	197
Figure 12 – Détail 2 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	197
Figure 13 – Détail 3 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	198
Figure 14 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions polyphasées	199
Figure 15 – Détail 2 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions polyphasées	200
Figure 16 – Essai de marquage pour la classe A	221
Figure 17 – Essai de l'incertitude d'horloge	222
Figure 18 – Exemple d'un événement RVC	227
Figure 19 – Forme d'onde de l'essai A13.1.1	230
Figure 20 – Forme d'onde de l'essai A13.1.1 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	231
Figure 21 – Forme d'onde de l'essai A13.1.2	233
Figure 22 – Forme d'onde de l'essai A13.1.2 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	234
Figure 23 – Forme d'onde de l'essai A13.1.3	236
Figure 24 – Forme d'onde de l'essai A13.1.3 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	237
Figure 25 – Forme d'onde de l'essai A13.2.1	239
Figure 26 – Forme d'onde de l'essai A13.2.1 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	240
Figure 27 – Forme d'onde de l'essai A13.1.3. 4	242
Figure 28 – Forme d'onde de l'essai A13.3.1 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	243
Figure 29 – Forme d'onde de l'essai A13.4.1 à 50 Hz	245

Figure 47 – Forme d'onde de l'essai A13.4.1 avec les limites RVC et la tension en régime établi à 50 Hz	246
Figure 30 – Forme d'onde de l'essai A13.5.1	249
Figure 31 – Forme d'onde de l'essai A13.5.1 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	250
Figure 32 – Forme d'onde de l'essai A13.5.2	252
Figure 33 – Forme d'onde de l'essai A13.5.2 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	253
Figure 34 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des creux conformément à l'essai S4.1.2	264
Figure 35 – Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des creux conformément à l'essai S4.1.2	264
Figure 36 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions conformément à l'essai S4.1.2	265
Figure 37 – Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des surtensions conformément à l'essai S4.1.2	265
Figure 38 – Essai de la tension de référence de glissement	266
Figure 39 – Condition de démarrage de la référence de glissement	266
Figure 40 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	268
Figure 41 – Détail 2 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	268
Figure 42 – Détail 3 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	269
Figure 43 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions polyphasées	270
Figure 44 – Détail 2 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions polyphasées	271
Figure 45 – Essai de marquage pour la classe S	281
Figure 46 – Essai de l'incertitude d'horloge	282
Figure A.1 – Différents types d'incertitudes	290
Figure D.1 – Essai phase-neutre sur les réseaux triphasés	296
Figure D.2 – Essai entre phases sur les réseaux triphasés	296
Figure E.1 – Exemple d'injection typique à N cycle sur une phase	300
Figure E.2 – Essai de précision de creux/coupe (amplitude et temps)	301
Figure E.3 – Essai de précision de surtension (amplitude et temps)	301
Figure G.1 – Signal simulé dans des conditions de bruit	306
Figure G.2 – Forme d'onde pour le contrôle de la mesure de tension efficace sans intervalles	307
Figure G.3 – Fréquence de fluctuation de 2,3 Hz	307
Figure G.4 – Effets de fuite spectrale pour un échantillon manquant	308
Figure G.5 – Représentation de Q_{RMS} pour les échantillons manquants	309
Figure G.6 – Détection d'un seul échantillon manquant	309
Figure G.7 – Q_{RMS} pour un signal idéal, erreur d'échantillonnage = -300×10^{-6}	310
Figure G.8 – Q_{RMS} pour un signal idéal, erreur d'échantillonnage = 400×10^{-6}	310
Figure G.9 – Q_{RMS} pour un signal idéal, erreur d'échantillonnage = 200×10^{-6}	311
Figure G.10 – $Q_H(5)$ avec un signal d'essai idéal et une synchronisation de fréquence d'échantillonnage parfaite	312
Figure G.11 – $Q_H(5)$ avec une erreur de fréquence d'échantillonnage de 300×10^{-6} et une erreur de fréquence de modulation de 100×10^{-6}	312

Figure G.12 – Q_{RMS} avec une fenêtre à curseur 20/24 cycles avec une valeur générée tous les 10/12 cycles	313
Figure G.13 – Essai d'amplitude pour le composant fluctuant.....	314
 Tableau 1 – Résumé des essais de type pour la classe A	171
Tableau 2 – Résumé des essais de type pour la classe S	173
Tableau 3 – Points d'essai pour chaque paramètre mesuré.....	175
Tableau 4 – Liste des "grandeurs d'influence des réseaux électriques" uniques	177
Tableau 5 – Influence de la température.....	178
Tableau 6 – Influence de la tension d'alimentation auxiliaire	178
Tableau 7 – Liste des critères d'essai génériques.....	179
Tableau 8 – Spécification de l'essai A13.1.1.....	229
Tableau 9 – Spécification de l'essai A13.1.2.....	232
Tableau 10 – Spécification de l'essai A13.1.3.....	235
Tableau 11 – Spécification de l'essai A13.2.1.....	238
Tableau 12 – Spécification de l'essai A13.3.1.....	241
Tableau 13 – Spécification de l'essai A13.4.1.....	244
Tableau 14 – Spécification de l'essai A13.5.1.....	248
Tableau 15 – Spécification de l'essai A13.5.2.....	251
Tableau 16 – Exigences d'incertitude	289
Tableau D.1 – Modèles d'essai.....	297
Tableau H.1 – Plage d'essai.....	315
Tableau H.2 – Incertitude de la source et du compteur de référence	316
Tableau H.3 – Stabilité de la source	316
Tableau I.1 – Exemple de déclaration de conformité selon l'IEC 62586-1	319
Tableau I.2 – Exemple de déclaration de conformité selon l'IEC 62586-2	321

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MESURE DE LA QUALITÉ DE L'ALIMENTATION DANS LES RÉSEAUX D'ALIMENTATION –

Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 62586-2 édition 2.1 contient la deuxième édition (2017-03) [documents 85/525/CDV et 85/571/RVC], son corrigendum 1 (2018-06) et son amendement 1 (2021-09) [documents 85/770/FDIS et 85/795/RVD].

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 62586-2 a été établie par le comité d'études 85 de l'IEC:
Equipements de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques

Cette deuxième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) ajout des procédures d'essai des RVC et du courant;
- b) correction d'erreurs.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62586, publiées sous le titre général *Mesure de la qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous [webstore.iec.ch](#) dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La qualité de l'alimentation est de plus en plus importante dans les réseaux d'alimentation à l'échelle mondiale et est généralement évaluée par des instruments de qualité de l'alimentation.

La présente partie de l'IEC 62586 spécifie les essais fonctionnels et les essais d'incertitude destinés à vérifier la conformité d'un produit par rapport aux méthodes de mesure de la classe A et de la classe S définies dans l'IEC 61000-4-30.

Ainsi, ce document complète l'IEC 61000-4-30.

MESURE DE LA QUALITÉ DE L'ALIMENTATION DANS LES RÉSEAUX D'ALIMENTATION –

Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62586 spécifie les essais fonctionnels et les exigences d'incertitude pour les instruments dont les fonctions incluent la mesure, l'enregistrement et, éventuellement, la surveillance des paramètres de qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation, et dont les méthodes de mesure (classe A ou classe S) sont définies dans l'IEC 61000-4-30.

La présente norme s'applique aux instruments de qualité de l'alimentation conformes à l'IEC 62586-1.

Cette norme peut également apparaître sous forme de référence dans d'autres normes de produits (p. ex. sur les enregistreurs de défauts numériques, les appareils de mesure des revenus, les relais de protection MV ou HV) spécifiant des appareils incorporant des fonctions de qualité de l'alimentation de classe A ou de classe S selon l'IEC 61000-4-30.

Ces exigences sont applicables aux réseaux d'alimentation en courant alternatif monophasés, biphasés (phase divisée) et triphasés à 50 Hz ou 60 Hz.

La présente norme ne concerne pas l'interface utilisateur ni les thèmes sans rapport avec les performances de mesure des appareils.

La présente norme ne concerne pas le post-traitement et l'interprétation des données, par exemple avec un logiciel dédié.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 61000-2-4, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-4: Environnement – Niveaux de compatibilité dans les installations industrielles pour les perturbations conduites à basse fréquence*

IEC 61000-4-7, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-7: Techniques d'essai et de mesure – Guide général relatif aux mesures d'harmoniques et d'interharmoniques, ainsi qu'à l'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d'alimentation et aux appareils qui y sont raccordés*

IEC 61000-4-15, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-15: Techniques d'essai et de mesure – Flickermètre – Spécifications fonctionnelles et de conception*

IEC 61000-4-30:2015, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-30: Techniques d'essai et de mesure – Méthodes de mesure de la qualité de l'alimentation*

IEC 62586-1:2013, *Mesure de la qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation – Partie 1: Instruments de mesure de la qualité de l'alimentation*

ISO/IEC Guide 98-3:2008, *Incertitude de mesure – Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM:1995)*

FINAL VERSION

VERSION FINALE



**Power quality measurement in power supply systems –
Part 2: Functional tests and uncertainty requirements**

**Mesure de la qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation –
Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude**



CONTENTS

FOREWORD.....	9
INTRODUCTION.....	11
1 Scope.....	12
2 Normative references.....	12
3 Terms, definitions, abbreviated terms, notations and symbols.....	13
3.1 General terms and definitions	13
3.2 Terms and definitions related to uncertainty.....	13
3.3 Notations	14
3.3.1 Functions.....	14
3.3.2 Symbols and abbreviated terms.....	14
3.3.3 Indices.....	14
4 Requirements	14
4.1 Requirements for products complying with class A	14
4.2 Requirements for products complying with class S	15
5 Functional type tests common requirements	17
5.1 General philosophy for testing	17
5.1.1 System topology	17
5.1.2 Stabilization time	17
5.1.3 Measuring ranges	17
5.1.4 Single "power-system influence quantities"	19
5.1.5 "External influence quantities"	21
5.1.6 Test criteria	21
5.2 Testing procedure	22
5.2.1 Device under test.....	22
5.2.2 Testing conditions	22
5.2.3 Testing equipment	22
6 Functional testing procedure for instruments complying with class A according to IEC 61000-4-30	22
6.1 Power frequency	22
6.1.1 General	22
6.1.2 Measurement method.....	23
6.1.3 Measurement uncertainty and measuring range	23
6.1.4 Measurement evaluation	24
6.1.5 Measurement aggregation	24
6.2 Magnitude of supply voltage	24
6.2.1 Measurement method.....	24
6.2.2 Measurement uncertainty and measuring range	24
6.2.3 Measurement evaluation	25
6.2.4 Measurement aggregation	25
6.3 Flicker	27
6.4 Supply voltage interruptions, dips and swells	27
6.4.1 General	27
6.4.2 Check dips / interruptions in polyphase system.....	35
6.4.3 Check swells in polyphase system.....	37
6.5 Supply voltage unbalance.....	38
6.5.1 General	38

6.5.2	Measurement method, measurement uncertainty and measuring range	39
6.5.3	Aggregation	39
6.6	Voltage harmonics	39
6.6.1	Measurement method.....	39
6.6.2	Measurement uncertainty and measuring range.....	40
6.6.3	Measurement evaluation	41
6.6.4	Measurement aggregation	41
6.7	Voltage interharmonics.....	43
6.7.1	Measurement method.....	43
6.7.2	Measurement uncertainty and measuring range.....	44
6.7.3	Measurement evaluation	45
6.7.4	Measurement aggregation	45
6.8	Mains signalling voltages on the supply voltage	47
6.8.1	Measurement method.....	47
6.8.2	Measurement uncertainty and measuring range	49
6.8.3	Aggregation	50
6.9	Measurement of underdeviation and overdeviation parameters.....	50
6.9.1	Measurement method.....	50
6.9.2	Measurement uncertainty and measuring range	52
6.9.3	Measurement evaluation	53
6.9.4	Measurement aggregation	53
6.10	Flagging.....	56
6.11	Clock uncertainty testing	58
6.12	Variations due to external influence quantities	58
6.12.1	General	58
6.12.2	Influence of temperature	59
6.12.3	Influence of power supply voltage.....	61
6.13	Rapid voltage changes (RVC).....	62
6.13.1	RVC parameters and evaluation	62
6.13.2	General	62
6.13.3	"No RVC" tests	64
6.13.4	"RVC threshold and setup" test	69
6.13.5	"RVC parameters" test	71
6.13.6	"RVC polyphase" test	73
6.13.7	"Voltage is in steady-state condition" tests.....	75
6.14	Magnitude of current	78
6.15	Harmonic current	78
6.16	Interharmonic currents	78
6.17	Current unbalance.....	78
6.17.1	General	78
6.17.2	Measurement method, measurement uncertainty and measuring range	79
7	Functional testing procedure for instruments complying with class S according to IEC 61000-4-30	79
7.1	Power frequency	79
7.1.1	General	79
7.1.2	Measurement method.....	80
7.1.3	Measurement uncertainty and measuring range	80
7.1.4	Measurement evaluation	81
7.1.5	Measurement aggregation	81

7.2	Magnitude of the supply voltage	81
7.2.1	Measurement method.....	81
7.2.2	Measurement uncertainty and measuring range	81
7.2.3	Measurement evaluation	82
7.2.4	Measurement aggregation	82
7.3	Flicker	84
7.4	Supply voltage interruptions, dips and swells	84
7.4.1	General requirements.....	84
7.4.2	Check dips / interruptions in polyphase system.....	90
7.4.3	Check swells in polyphase system.....	92
7.5	Supply voltage unbalance.....	93
7.5.1	General	93
7.5.2	Measurement method, measurement uncertainty and measuring range	94
7.5.3	Aggregation	94
7.6	Voltage harmonics	94
7.6.1	General	94
7.6.2	Measurement method.....	95
7.6.3	Measurement method, measurement uncertainty and measuring range	96
7.6.4	Measurement evaluation	97
7.6.5	Measurement aggregation	97
7.7	Voltage interharmonics.....	99
7.8	Mains signalling voltages on the supply voltage	99
7.8.1	General	99
7.8.2	Measurement method.....	100
7.8.3	Measurement uncertainty and measuring range	100
7.8.4	Aggregation	100
7.9	Measurement of underdeviation and overdeviation parameters.....	100
7.10	Flagging.....	100
7.11	Clock uncertainty testing	102
7.12	Variations due to external influence quantities	103
7.12.1	General	103
7.12.2	Influence of temperature	104
7.12.3	Influence of power supply voltage.....	106
7.13	Rapid voltage changes	107
7.14	Magnitude of current	107
7.15	Harmonic current	107
7.16	Interharmonic currents	107
7.17	Current unbalance.....	107
7.17.1	General	107
7.17.2	Measurement method, measurement uncertainty and measuring range	108
8	Calculation of measurement uncertainty and operating uncertainty	109
Annex A (normative)	Intrinsic uncertainty and operating uncertainty,.....	111
A.1	General.....	111
A.2	Measurement uncertainty	111
A.3	Operating uncertainty	112
Annex B (informative)	Overall system uncertainty	113
Annex C (normative)	Calculation of measurement and operating uncertainty for voltage magnitude and power frequency.....	114

C.1	Selection of test points to verify operating uncertainty and uncertainty under reference conditions.....	114
C.2	Class A calculation examples	114
C.2.1	General	114
C.2.2	Parameter: magnitude of supply voltage, $U_{\text{din}} = 230 \text{ V}$, 50/60Hz, rated range of temperature -25°C to $+55^{\circ}\text{C}$	114
C.2.3	Parameter: power frequency 50/60 Hz, rated range of temperature -25°C to $+55^{\circ}\text{C}$	115
Annex D (informative)	Further test on dips (amplitude and phase angles changes).....	117
D.1	Phase-to-phase or phase-to-neutral testing.....	117
D.2	Test method.....	117
Annex E (informative)	Further tests on dips (polyphase): test procedure	119
E.1	General.....	119
E.2	Phase voltage dips and interruptions	120
E.3	Phase swells.....	120
Annex F (normative)	Gapless measurements of voltage amplitude and harmonics test	122
F.1	Purpose of the test.....	122
F.2	Test set up.....	122
F.3	Voltage amplitude	122
F.3.1	Test signal	122
F.3.2	Result evaluation	122
F.4	Harmonics	123
F.4.1	Test signal	123
F.4.2	Result evaluation	123
F.5	Inter-harmonics	124
F.5.1	Test signal	124
F.5.2	Result evaluation	124
Annex G (informative)	Gapless measurements of voltage amplitude and harmonics	125
Annex H (informative)	Testing equipment recommendations	134
H.1	Testing range	134
H.2	Uncertainty and stability of source and reference meter	134
H.2.1	Uncertainty of source and reference meter	134
H.2.2	Stability of the source.....	135
H.3	Time synchronisation	135
H.4	Power quality functions of source and reference meter.....	135
H.5	Traceability	136
Annex I (informative)	Recommendations related to a declaration of conformity (DoC) and a test report	137
I.1	Definitions.....	137
I.2	Recommendations.....	137
I.3	Example of IEC 62586-1 declaration of conformity	137
I.4	Example of IEC 62586-2 declaration	139
I.4.1	General	139
I.4.2	Recommendation for IEC 62586-2 test report	140
I.4.3	Recommendation for IEC 62586-2 test summary.....	141
I.4.4	Recommendation for IEC 62586-2 test equipment information.....	141
I.4.5	Recommendation for IEC 62586-2 tested functions	141
Bibliography	142

Figure 1 – Overview of test for dips according to test A4.1.1	30
Figure 2 – Detail 1 of waveform for test of dips according to test A4.1.1	31
Figure 3 – Detail 2 of waveform for tests of dips according to A4.1.1	31
Figure 4 – Detail 3 of waveform for tests of dips according to test A4.1.1	32
Figure 5 – Detail 1 of waveform for test of dips according to test A4.1.2	32
Figure 6 – Detail 2 of waveform for tests of dips according to test A4.1.2	33
Figure 7 – Detail 1 of waveform for test of swells according to test A4.1.2	33
Figure 8 – Detail 2 of waveform for tests of swells according to test A4.1.2	34
Figure 9 – Sliding reference voltage test	34
Figure 10 – Sliding reference start up condition	35
Figure 11 – Detail 1 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	36
Figure 12 – Detail 2 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	36
Figure 13 – Detail 3 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	37
Figure 14 – Detail 1 of waveform for test of polyphase swells	38
Figure 15 – Detail 2 of waveform for test of polyphase swells	38
Figure 16 – Flagging test for class A	57
Figure 17 – Clock uncertainty testing	58
Figure 18 – Example of RVC event	62
Figure 19 – Test A13.1.1 waveform	65
Figure 20 – Test A13.1.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	65
Figure 21 – Test A13.1.2 waveform	66
Figure 22 – Test A13.1.2 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	67
Figure 23 – Test A13.1.3 waveform	68
Figure 24 – Test A13.1.3 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	69
Figure 25 – Test A13.2.1 waveform	70
Figure 26 – Test A13.2.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	70
Figure 27 – Test A13.3.1 waveform	72
Figure 28 – Test A13.3.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	72
Figure 29 – Test A13.4.1 waveform at 50 Hz	74
Figure 47 – Test A13.4.1 waveform with RVC limits and VSS at 50 Hz	74
Figure 30 – Test A13.5.1 waveform	75
Figure 31 – Test A13.5.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	76
Figure 32 – Test A13.5.2 waveform	77
Figure 33 – Test A13.5.2 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz	78
Figure 34 – Detail 1 of waveform for test of dips according to test S4.1.2	87
Figure 35 – Detail 2 of waveform for tests of dips according to test S4.1.2	87
Figure 36 – Detail 1 of waveform for test of swells according to test S4.1.2	88
Figure 37 – Detail 2 of waveform for tests of swells according to test S4.1.2	88
Figure 38 – Sliding reference voltage test	89
Figure 39 – Sliding reference start-up condition	89
Figure 40 – Detail 1 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	91
Figure 41 – Detail 2 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	91
Figure 42 – Detail 3 of waveform for test of polyphase dips/interruptions	92

Figure 43 – Detail 1 of waveform for test of polyphase swells	93
Figure 44 – Detail 2 of waveform for test of polyphase swells	93
Figure 45 – Flagging test for class S	102
Figure 46 – Clock uncertainty testing.....	103
Figure A.1 – Different kinds of uncertainties	111
Figure D.1 – Phase-to-neutral testing on three-phase systems.....	117
Figure D.2 – Phase-to-phase testing on three-phase systems	117
Figure E.1 – Example for one phase of a typical N cycle injection	119
Figure E.2 – Dip/interruption accuracy (amplitude and timing) test	120
Figure E.3 – Swell accuracy (amplitude and timing) test	121
Figure G.1 – Simulated signal under noisy conditions	125
Figure G.2 – Waveform for checking gapless RMS voltage measurement.....	126
Figure G.3 – 2,3 Hz frequency fluctuation	126
Figure G.4 – Spectral leakage effects for a missing sample	127
Figure G.5 – Illustration of \mathcal{Q}_{RMS} for missing samples.....	128
Figure G.6 – Detection of a single missing sample.....	128
Figure G.7 – \mathcal{Q}_{RMS} for an ideal signal, sampling error = -300×10^{-6}	129
Figure G.8 – \mathcal{Q}_{RMS} for an ideal signal, sampling error = 400×10^{-6}	129
Figure G.9 – \mathcal{Q}_{RMS} for an ideal signal, sampling error = 200×10^{-6}	130
Figure G.10 – $\mathcal{Q}_{\text{H}}(5)$ with ideal test signal and perfect sampling frequency synchronization	131
Figure G.11 – $\mathcal{Q}_{\text{H}}(5)$ with 300×10^{-6} sampling frequency error and 100×10^{-6} modulation frequency error	131
Figure G.12 – \mathcal{Q}_{RMS} with a 20/24-cycle sliding window with an output every 10/12 cycles.....	132
Figure G.13 – Amplitude test for fluctuating component	132
 Table 1 – Summary of type tests for class A	15
Table 2 – Summary of type tests for class S	16
Table 3 – Testing points for each measured parameter	18
Table 4 – List of single "power-system influence quantities".....	20
Table 5 – Influence of temperature	21
Table 6 – Influence of auxiliary power supply voltage	21
Table 7 – List of generic test criteria.....	22
Table 8 – Specification of test A13.1.1	64
Table 9 – Specification of test A13.1.2	66
Table 10 – Specification of test A13.1.3	68
Table 11 – Specification of test A13.2.1	69
Table 12 – Specification of test A13.3.1	71
Table 13 – Specification of test A13.4.1	73
Table 14 – Specification of test A13.5.1	75
Table 15 – Specification of test A13.5.2	77
Table 16 – Uncertainty requirements	110
Table D.1 – Tests pattern.....	118

Table H.1 – Testing range.....	134
Table H.2 – Uncertainty of source and reference meter.....	135
Table H.3 – Stability of source	135
Table I.1 – Example of a DoC related to compliance with IEC 62586-1.....	138
Table I.2 – Example of DoC related to compliance with IEC 62586-2.....	140

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER SUPPLY SYSTEMS –

Part 2: Functional tests and uncertainty requirements

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 62586-2 edition 2.1 contains the second edition (2017-03) [documents 85/525/CDV and 85/571/RVC], its corrigendum 1 (2018-06) and its amendment 1 (2021-09) [documents 85/770/FDIS and 85/795/RVD].

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard IEC 62586-2 has been prepared by IEC technical committee 85: Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities.

This second edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) test procedures for RVC and current have been added;
- b) mistakes have been fixed.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 62586 series, published under the general title *Power quality measurement in power supply systems*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under [webstore.iec.ch](#) in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

Power quality is more and more important worldwide in power supply systems and is generally assessed by power quality instruments.

This part of IEC 62586 specifies functional and uncertainty tests intended to verify the compliance of a product to class A and class S measurement methods defined in IEC 61000-4-30.

This document therefore complements IEC 61000-4-30.

POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER SUPPLY SYSTEMS –**Part 2: Functional tests and uncertainty requirements****1 Scope**

This part of IEC 62586 specifies functional tests and uncertainty requirements for instruments whose functions include measuring, recording, and possibly monitoring power quality parameters in power supply systems, and whose measuring methods (class A or class S) are defined in IEC 61000-4-30.

This document applies to power quality instruments complying with IEC 62586-1.

This document can also be referred to by other product standards (e.g. digital fault recorders, revenue meters, MV or HV protection relays) specifying devices embedding class A or class S power quality functions according to IEC 61000-4-30.

These requirements are applicable in single-, dual- (split phase) and 3-phase AC power supply systems at 50 Hz or 60 Hz.

It is not the intent of this document to address user interface or topics unrelated to device measurement performance.

The document does not cover post-processing and interpretation of the data, for example with dedicated software.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61000-2-4, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-4: Environment – Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances*

IEC 61000-4-7, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7: Testing and measurement techniques – General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto*

IEC 61000-4-15, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-15: Testing and measurement techniques – Flickermeter – Functional and design specifications*

IEC 61000-4-30:2015, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods*

IEC 62586-1:2013, *Power quality measurement in power supply systems – Part 1: Power quality instruments (PQI)*

ISO/IEC Guide 98-3:2008, *Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	151
INTRODUCTION	153
1 Domaine d'application	154
2 Références normatives	154
3 Termes, définitions, termes abrégés, notations et symboles	155
3.1 Termes et définitions généraux	155
3.2 Termes et définitions relatifs à l'incertitude	155
3.3 Notations	156
3.3.1 Fonctions	156
3.3.2 Symboles et abréviations	156
3.3.3 Indices	156
4 Exigences	157
4.1 Exigences concernant les produits conformes à la classe A	157
4.2 Exigences concernant les produits conformes à la classe S	158
5 Exigences communes aux essais de type fonctionnel	160
5.1 Philosophie générale des essais	160
5.1.1 Topologie du système	160
5.1.2 Temps de stabilisation	160
5.1.3 Etendues de mesure	160
5.1.4 "Grandeurs d'influence des réseaux électriques" simples	162
5.1.5 "Grandeurs d'influence externes"	164
5.1.6 Critères d'essai	164
5.2 Procédure d'essai	165
5.2.1 Appareil soumis à l'essai	165
5.2.2 Conditions d'essai	165
5.2.3 Equipement d'essai	165
6 Procédure d'essais fonctionnels pour les instruments conformes à la classe A selon l'IEC 61000-4-30	166
6.1 Fréquence industrielle	166
6.1.1 Généralités	166
6.1.2 Méthode de mesure	166
6.1.3 Incertitude de mesure et étendue de mesure	166
6.1.4 Evaluation de mesure	167
6.1.5 Agrégation de mesure	167
6.2 Amplitude de la tension d'alimentation	167
6.2.1 Méthode de mesure	167
6.2.2 Incertitude de mesure et étendue de mesure	167
6.2.3 Evaluation de mesure	168
6.2.4 Agrégation de mesure	168
6.3 Papillotement	170
6.4 Coupures, creux et surtensions de la tension d'alimentation	170
6.4.1 Généralités	170
6.4.2 Vérification des creux/coupures dans un réseau polyphasé	179
6.4.3 Vérification des surtensions dans un réseau polyphasé	182
6.5 Déséquilibre de tension d'alimentation	183
6.5.1 Généralités	183

6.5.2	Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure	184
6.5.3	Agrégation	184
6.6	Harmoniques de tension	184
6.6.1	Méthode de mesure	184
6.6.2	Incertitude de mesure et étendue de mesure	186
6.6.3	Evaluation de mesure	187
6.6.4	Agrégation de mesure	187
6.7	Interharmoniques de tension	188
6.7.1	Méthode de mesure	188
6.7.2	Incertitude de mesure et étendue de mesure	189
6.7.3	Evaluation de mesure	190
6.7.4	Agrégation de mesure	190
6.8	Tension de transmission de signaux sur la tension d'alimentation	193
6.8.1	Méthode de mesure	193
6.8.2	Incertitude de mesure et étendue de mesure	195
6.8.3	Agrégation	197
6.9	Mesure des paramètres de valeur basse et de valeur haute de la tension	197
6.9.1	Méthode de mesure	197
6.9.2	Incertitude de mesure et étendue de mesure	199
6.9.3	Evaluation de mesure	200
6.9.4	Agrégation de mesure	200
6.10	Marquage	203
6.11	Essai de l'incertitude d'horloge	205
6.12	Variations en fonction des grandeurs d'influence externes	205
6.12.1	Généralités	205
6.12.2	Influence de la température	206
6.12.3	Influence de la tension d'alimentation	208
6.13	Variations rapides de tension (RVC)	209
6.13.1	Paramètres RVC et évaluation	209
6.13.2	Généralités	210
6.13.3	Essais "Pas d'événement RVC"	212
6.13.4	Essai "seuil et configuration RVC"	216
6.13.5	Essai "paramètres RVC"	218
6.13.6	Essais "événement polyphasé RVC"	220
6.13.7	Essais "condition VSS (tension en régime établi)"	222
6.14	Amplitude du courant	225
6.15	Courant harmonique	225
6.16	Courants interharmoniques	225
6.17	Déséquilibre de courant	225
6.17.1	Généralités	225
6.17.2	Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure	226
7	Procédure d'essais fonctionnels pour les instruments conformes à la classe S selon l'IEC 61000-4-30	227
7.1	Fréquence industrielle	227
7.1.1	Généralités	227
7.1.2	Méthode de mesure	227
7.1.3	Incertitude de mesure et étendue de mesure	227
7.1.4	Evaluation de mesure	228
7.1.5	Agrégation de mesure	228

7.2	Amplitude de la tension d'alimentation	228
7.2.1	Méthode de mesure	228
7.2.2	Incertitude de mesure et étendue de mesure	229
7.2.3	Evaluation de mesure.....	229
7.2.4	Agrégation de mesure	229
7.3	Papillotement	231
7.4	Coupures, creux et surtensions de la tension d'alimentation.....	231
7.4.1	Exigences générales	232
7.4.2	Vérification des creux/coupures dans un réseau polyphasé.....	238
7.4.3	Vérification des surtensions dans un réseau polyphasé.....	241
7.5	Déséquilibre de tension d'alimentation	242
7.5.1	Généralités	242
7.5.2	Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure	243
7.5.3	Agrégation	243
7.6	Harmoniques de tension.....	243
7.6.1	Généralités	243
7.6.2	Méthode de mesure	244
7.6.3	Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure	246
7.6.4	Evaluation de mesure.....	247
7.6.5	Agrégation de mesure	247
7.7	Interharmoniques de tension	249
7.8	Tension de transmission de signaux sur la tension d'alimentation.....	249
7.8.1	Généralités	249
7.8.2	Méthode de mesure	250
7.8.3	Incertitude de mesure et étendue de mesure	250
7.8.4	Agrégation	250
7.9	Mesure des paramètres de valeur basse et de valeur haute de la tension.....	250
7.10	Marquage	250
7.11	Essai de l'incertitude d'horloge	252
7.12	Variations en fonction des grandeurs d'influence externes	253
7.12.1	Généralités	253
7.12.2	Influence de la température	254
7.12.3	Influence de la tension d'alimentation	256
7.13	Variations rapides de tension (RVC)	257
7.14	Amplitude du courant	257
7.15	Courant harmonique.....	257
7.16	Courants interharmoniques.....	257
7.17	Déséquilibre de courant.....	257
7.17.1	Généralités	257
7.17.2	Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure	258
8	Calcul de l'incertitude de mesure et de l'incertitude de fonctionnement	259
Annexe A (normative)	Incertitude intrinsèque et incertitude de fonctionnement.....	261
A.1	Généralités	261
A.2	Incertitude de mesure.....	261
A.3	Incertitude de fonctionnement.....	262
Annexe B (informative)	Incertitude système global.....	263
Annexe C (normative)	Calcul des incertitudes de mesure et de fonctionnement pour l'amplitude de tension et la fréquence industrielle	264

C.1	Choix de points d'essai pour vérifier l'incertitude de fonctionnement et l'incertitude dans les conditions de référence	264
C.2	Exemples de calculs pour la classe A	264
C.2.1	Généralités	264
C.2.2	Paramètre: amplitude de la tension d'alimentation, $U_{\text{din}} = 230 \text{ V}$, 50/60 Hz, plage assignée de températures -25°C à $+55^{\circ}\text{C}$	264
C.2.3	Paramètre: fréquence industrielle 50/60 Hz, plage assignée de températures de -25°C à $+55^{\circ}\text{C}$	265
Annexe D (informative)	Essai supplémentaire sur les creux (variations de l'amplitude et des angles de phase)	267
D.1	Essais entre phases ou phase-neutre	267
D.2	Méthode d'essai	267
Annexe E (informative)	Essais supplémentaires sur les creux (polyphasés): procédure d'essai	270
E.1	Généralités	270
E.2	Creux de tension de phase et coupures	271
E.3	Surtensions de phase	271
Annexe F (normative)	Essai des mesures sans intervalles de l'amplitude de tension et des harmoniques	273
F.1	Objectif de l'essai	273
F.2	Configuration de l'essai	273
F.3	Amplitude de tension	273
F.3.1	Signal d'essai	273
F.3.2	Evaluation du résultat	274
F.4	Harmoniques	274
F.4.1	Signal d'essai	274
F.4.2	Evaluation du résultat	274
F.5	Interharmoniques	275
F.5.1	Signal d'essai	275
F.5.2	Evaluation du résultat	275
Annexe G (informative)	Mesures sans intervalles de l'amplitude de tension et des harmoniques	277
Annexe H (informative)	Recommandations relatives à l'équipement d'essai	286
H.1	Plage d'essai	286
H.2	Incertitude et stabilité de la source et du compteur de référence	286
H.2.1	Incertitude de la source et du compteur de référence	286
H.2.2	Stabilité de la source	287
H.3	Synchronisation temporelle	287
H.4	Fonctions de qualité de l'alimentation de la source et du compteur de référence	288
H.5	Traçabilité	288
Annexe I (informative)	Recommandations relatives à la déclaration de conformité et au rapport d'essai	289
I.1	Définitions	289
I.2	Recommandations	289
I.3	Exemple de déclaration de conformité selon l'IEC 62586-1	289
I.4	Exemple de déclaration de conformité selon l'IEC 62586-2	291
I.4.1	Généralités	291
I.4.2	Recommandation pour le rapport d'essai selon l'IEC 62586-2	293
I.4.3	Recommandation pour le résumé de l'essai selon l'IEC 62586-2	293

I.4.4	Recommandation pour les informations sur l'équipement d'essai selon l'IEC 62586-2.....	293
I.4.5	Recommandation pour les fonctions soumises à l'essai selon l'IEC 62586-2.....	293
Bibliographie	294	

Figure 1 – Vue d'ensemble de l'essai pour les creux conformément à l'essai A4.1.1	174
Figure 2 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des creux conformément à l'essai A4.1.1	175
Figure 3 – Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des creux conformément à l'essai A4.1.1	175
Figure 4 – Détail 3 de la forme d'onde pour les essais des creux conformément à l'essai A4.1.1	176
Figure 5 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des creux conformément à l'essai A4.1.2	176
Figure 6 – Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des creux conformément à l'essai A4.1.2	177
Figure 7 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions conformément à l'essai A4.1.2	177
Figure 8 – Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des surtensions conformément à l'essai A4.1.2	178
Figure 9 – Essai de la tension de référence de glissement.....	178
Figure 10 – Condition de démarrage de la référence de glissement.....	179
Figure 11 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	180
Figure 12 – Détail 2 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	180
Figure 13 – Détail 3 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	181
Figure 14 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions polyphasées	182
Figure 15 – Détail 2 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions polyphasées	183
Figure 16 – Essai de marquage pour la classe A	204
Figure 17 – Essai de l'incertitude d'horloge	205
Figure 18 – Exemple d'un événement RVC	210
Figure 19 – Forme d'onde de l'essai A13.1.1	212
Figure 20 – Forme d'onde de l'essai A13.1.1 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	213
Figure 21 – Forme d'onde de l'essai A13.1.2	214
Figure 22 – Forme d'onde de l'essai A13.1.2 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	214
Figure 23 – Forme d'onde de l'essai A13.1.3	215
Figure 24 – Forme d'onde de l'essai A13.1.3 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	216
Figure 25 – Forme d'onde de l'essai A13.2.1	217
Figure 26 – Forme d'onde de l'essai A13.2.1 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	217
Figure 27 – Forme d'onde de l'essai A13.1.3	219
Figure 28 – Forme d'onde de l'essai A13.3.1 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	219
Figure 29 – Forme d'onde de l'essai A13.4.1 à 50 Hz	221

Figure 47 – Forme d'onde de l'essai A13.4.1 avec les limites RVC et la tension en régime établi à 50 Hz	221
Figure 30 – Forme d'onde de l'essai A13.5.1	223
Figure 31 – Forme d'onde de l'essai A13.5.1 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	223
Figure 32 – Forme d'onde de l'essai A13.5.2	224
Figure 33 – Forme d'onde de l'essai A13.5.2 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique à 50 Hz	225
Figure 34 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des creux conformément à l'essai S4.1.2	235
Figure 35 – Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des creux conformément à l'essai S4.1.2	235
Figure 36 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions conformément à l'essai S4.1.2	236
Figure 37 – Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des surtensions conformément à l'essai S4.1.2	236
Figure 38 – Essai de la tension de référence de glissement	237
Figure 39 – Condition de démarrage de la référence de glissement	237
Figure 40 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	239
Figure 41 – Détail 2 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	239
Figure 42 – Détail 3 de la forme d'onde pour l'essai des creux/coupures polyphasés	240
Figure 43 – Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions polyphasées	241
Figure 44 – Détail 2 de la forme d'onde pour l'essai des surtensions polyphasées	242
Figure 45 – Essai de marquage pour la classe S	252
Figure 46 – Essai de l'incertitude d'horloge	253
Figure A.1 – Différents types d'incertitudes	261
Figure D.1 – Essai phase-neutre sur les réseaux triphasés	267
Figure D.2 – Essai entre phases sur les réseaux triphasés	267
Figure E.1 – Exemple d'injection typique à N cycle sur une phase	270
Figure E.2 – Essai de précision de creux/coupe (amplitude et temps)	271
Figure E.3 – Essai de précision de surtension (amplitude et temps)	272
Figure G.1 – Signal simulé dans des conditions de bruit	277
Figure G.2 – Forme d'onde pour le contrôle de la mesure de tension efficace sans intervalles	278
Figure G.3 – Fréquence de fluctuation de 2,3 Hz	278
Figure G.4 – Effets de fuite spectrale pour un échantillon manquant	279
Figure G.5 – Représentation de Q_{RMS} pour les échantillons manquants	280
Figure G.6 – Détection d'un seul échantillon manquant	280
Figure G.7 – Q_{RMS} pour un signal idéal, erreur d'échantillonnage = -300×10^{-6}	281
Figure G.8 – Q_{RMS} pour un signal idéal, erreur d'échantillonnage = 400×10^{-6}	281
Figure G.9 – Q_{RMS} pour un signal idéal, erreur d'échantillonnage = 200×10^{-6}	282
Figure G.10 – $Q_H(5)$ avec un signal d'essai idéal et une synchronisation de fréquence d'échantillonnage parfaite	283
Figure G.11 – $Q_H(5)$ avec une erreur de fréquence d'échantillonnage de 300×10^{-6} et une erreur de fréquence de modulation de 100×10^{-6}	283

Figure G.12 – Q_{RMS} avec une fenêtre à curseur 20/24 cycles avec une valeur générée tous les 10/12 cycles	284
Figure G.13 – Essai d'amplitude pour le composant fluctuant.....	285
Tableau 1 – Résumé des essais de type pour la classe A	157
Tableau 2 – Résumé des essais de type pour la classe S	159
Tableau 3 – Points d'essai pour chaque paramètre mesuré.....	161
Tableau 4 – Liste des "grandeurs d'influence des réseaux électriques" uniques	163
Tableau 5 – Influence de la température.....	164
Tableau 6 – Influence de la tension d'alimentation auxiliaire	164
Tableau 7 – Liste des critères d'essai génériques.....	165
Tableau 8 – Spécification de l'essai A13.1.1.....	212
Tableau 9 – Spécification de l'essai A13.1.2.....	213
Tableau 10 – Spécification de l'essai A13.1.3.....	215
Tableau 11 – Spécification de l'essai A13.2.1.....	216
Tableau 12 – Spécification de l'essai A13.3.1.....	218
Tableau 13 – Spécification de l'essai A13.4.1.....	220
Tableau 14 – Spécification de l'essai A13.5.1.....	222
Tableau 15 – Spécification de l'essai A13.5.2.....	224
Tableau 16 – Exigences d'incertitude	260
Tableau D.1 – Modèles d'essai.....	268
Tableau H.1 – Plage d'essai.....	286
Tableau H.2 – Incertitude de la source et du compteur de référence	287
Tableau H.3 – Stabilité de la source	287
Tableau I.1 – Exemple de déclaration de conformité selon l'IEC 62586-1	290
Tableau I.2 – Exemple de déclaration de conformité selon l'IEC 62586-2	292

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MESURE DE LA QUALITÉ DE L'ALIMENTATION DANS LES RÉSEAUX D'ALIMENTATION –

Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 62586-2 édition 2.1 contient la deuxième édition (2017-03) [documents 85/525/CDV et 85/571/RVC], son corrigendum 1 (2018-06) et son amendement 1 (2021-09) [documents 85/770/FDIS et 85/795/RVD].

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 62586-2 a été établie par le comité d'études 85 de l'IEC:
Equipements de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques

Cette deuxième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) ajout des procédures d'essai des RVC et du courant;
- b) correction d'erreurs.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62586, publiées sous le titre général *Mesure de la qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous [webstore.iec.ch](#) dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La qualité de l'alimentation est de plus en plus importante dans les réseaux d'alimentation à l'échelle mondiale et est généralement évaluée par des instruments de qualité de l'alimentation.

La présente partie de l'IEC 62586 spécifie les essais fonctionnels et les essais d'incertitude destinés à vérifier la conformité d'un produit par rapport aux méthodes de mesure de la classe A et de la classe S définies dans l'IEC 61000-4-30.

Ainsi, ce document complète l'IEC 61000-4-30.

MESURE DE LA QUALITÉ DE L'ALIMENTATION DANS LES RÉSEAUX D'ALIMENTATION –

Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62586 spécifie les essais fonctionnels et les exigences d'incertitude pour les instruments dont les fonctions incluent la mesure, l'enregistrement et, éventuellement, la surveillance des paramètres de qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation, et dont les méthodes de mesure (classe A ou classe S) sont définies dans l'IEC 61000-4-30.

La présente norme s'applique aux instruments de qualité de l'alimentation conformes à l'IEC 62586-1.

Cette norme peut également apparaître sous forme de référence dans d'autres normes de produits (p. ex. sur les enregistreurs de défauts numériques, les appareils de mesure des revenus, les relais de protection MV ou HV) spécifiant des appareils incorporant des fonctions de qualité de l'alimentation de classe A ou de classe S selon l'IEC 61000-4-30.

Ces exigences sont applicables aux réseaux d'alimentation en courant alternatif monophasés, biphasés (phase divisée) et triphasés à 50 Hz ou 60 Hz.

La présente norme ne concerne pas l'interface utilisateur ni les thèmes sans rapport avec les performances de mesure des appareils.

La présente norme ne concerne pas le post-traitement et l'interprétation des données, par exemple avec un logiciel dédié.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 61000-2-4, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-4: Environnement – Niveaux de compatibilité dans les installations industrielles pour les perturbations conduites à basse fréquence*

IEC 61000-4-7, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-7: Techniques d'essai et de mesure – Guide général relatif aux mesures d'harmoniques et d'interharmoniques, ainsi qu'à l'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d'alimentation et aux appareils qui y sont raccordés*

IEC 61000-4-15, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-15: Techniques d'essai et de mesure – Flickermètre – Spécifications fonctionnelles et de conception*

IEC 61000-4-30:2015, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-30: Techniques d'essai et de mesure – Méthodes de mesure de la qualité de l'alimentation*

IEC 62586-1:2013, *Mesure de la qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation – Partie 1: Instruments de mesure de la qualité de l'alimentation*

ISO/IEC Guide 98-3:2008, *Incertitude de mesure – Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM:1995)*